

XSDD50-19GRCH-SYS

材料分野の構造解析などで用いられているX線吸収微細構造測定に必要なシリコンドリフト検出器、データ計測ボード、検出器用電源が一つになりました。高い計数率とエネルギー分解能を有したシリコンドリフト検出器を多素子化し高感度化を実現しました。また、トランジスタリセット処理とDSP処理を適切に行うことで高計数測定が可能です。

グラフェン窓付シリコンドリフト検出器

XSDD50-19GRCH

●コリメート面積 893mm²

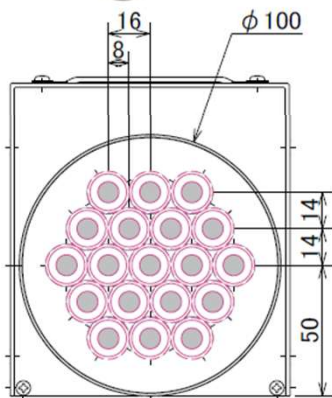
(collimated to 47mm²×19素子)

●有効面積 1235mm²

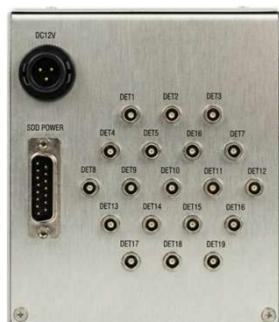
(65mm²×19素子)



筒長さ：150mm（デフォルト）
*改造は別途費用が発生いたします。



正面寸法図



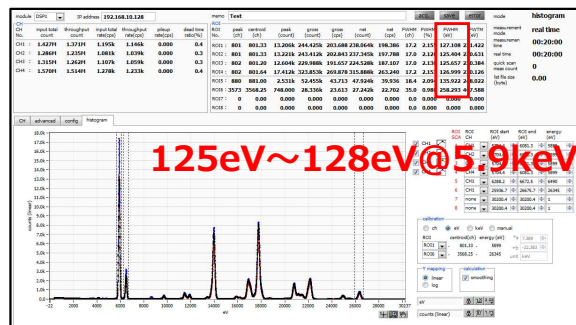
検出器背面



Desktop型
SDD信号処理装置
APU519XG
1台

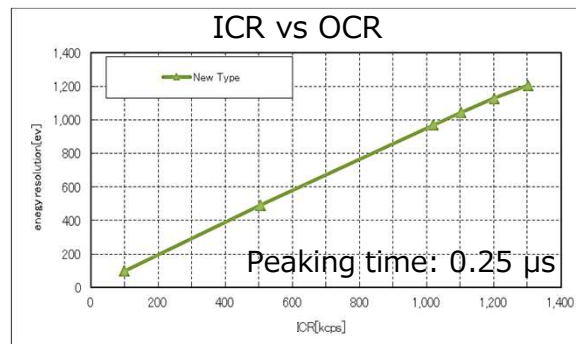
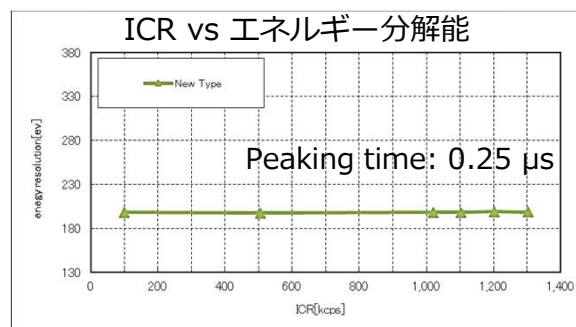


Desktop型
SDD電源ユニット
APU3900-19
1台



仕様

機能	ヒストグラム、ROI-SCA、Quick-Scan
エネルギー分解能	125eV~128eV@5.9 keV Mn-Ka (OCR: 1000 k, Peaking time: 0.25μs)
ADC	100 MHz, 16-bit
SDD用電源	-200V、±5V、+3.3V
通信1/F	ギガビットイーサネット (TCP/IP)
付属	データ収集アプリ、サンプルプログラム 取扱説明書
Peaking time	0.25 μs
カウントレート	1 Mcp
電源	AC100V



株式会社テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

TEL:029-350-8011 FAX:029-352-9013

info@techno-ap.com



※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。

<https://www.techno-ap.com>

20260409

